

ダイオード・トランジスタ・MOSFET実験装置

半導体実験装置

KENTAC1060

半導体実験装置ダイオード・トランジスタ・MOSFET等の正特性実験ができます。
電源内蔵ですから便利です。
KENTAC1060実験に必要な実験用各種抵抗・半導体等が標準装備

■ 特徴

- (1)各種パワーデバイス(トランジスタ・ダイオード・MOSFET)の静特性試験ができます。
- (2)直流可変電源・固定電源が付いていますから、電源をいくつも用意する必要はありません。
- (3)計測器はデジタル電圧計・デジタルテスタが付いているので、学校が計測器を用意する必要はありません。
- (4)実験に必要な抵抗・半導体等は用意されています。

■ 半導体実験装置(KENTAC1060)の仕様

直流可変電源	0~18V,1A 変換方式:アナログ方式 メータ:デジタル電圧計	パルス発生回路	方形波1Hzor1kHz
		DC電圧計	19.99V---1台
直流固定電源	+5V,1A	デジタルテスタ	3台(小数点以下2桁のmA電流が計測可能なもの)
直流固定電源	±15V,0.5A	付属基板	トランジスタ実験基板 ダイオード実験基板 MOSFET実験基板
その他の付属品	ブレッドボード、必要な電子部品		

学習の内容

○パワーエレクトロニクスのデバイスの静特性試験

- ☆ダイオード(ダイオードの特性)
 - 整流用ダイオード、ツェナーダイオード
 - 定電流ダイオード
- ☆トランジスタ(特性試験)
 - 増幅度(hFE)の測定、
 - VBE-IB、VCE-IC、IB-ICの静特性試験
 - 増幅回路&バイアスの実験
- ☆MOS-FET
 - VGS各種電圧下に於けるVDS-ID特性試験

